

Министерство образования и науки Российской Федерации
Кубанский государственный университет
Научный совет РАН по физике конденсированного состояния
Российский фонд фундаментальных исследований
Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова

ОПТИКА
И СПЕКТРОСКОПИЯ
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

Материалы XXIV международной конференции

Краснодар
2018

УДК 538.9
ББК 22.34
О-627

Организационный комитет:

В.А. Исаев (*председатель*), Mikhail G. Brik, Yu.V. Orlovskii, D. Richter,
С.С. Ануфрик, Е.В. Жариков, В.Б. Кравченко, Г. П. Яблонский,
М.Г. Барышев, Н.М. Богатов (*зам. председателя*), Е.П. Чукалина,
А.В. Шестаков, Н.А. Яковенко, Е.Н. Тумаев, Б.В. Игнатъев, С.А. Аванесов,
А.В. Лебедев

О-627 Оптика и спектроскопия конденсированных сред: материалы
XXIV Междунар. науч. конф. (под науч. ред. В.А. Исаева,
А.В. Лебедева) – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. – 372 с. –
500 экз.
ISBN 978-5-6041274-0-7

Настоящее издание содержит материалы XXIV Международной конференции «Оптика и спектроскопия конденсированных сред», посвященные современным исследованиям в области физики конденсированного состояния. Рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими и экспериментальными аспектами синтеза оптических материалов, их люминесцентных, генерационных, парамагнитных и нелинейных свойств.

Адресуются специалистам в области физики конденсированного состояния, преподавателям, магистрантам и аспирантам высших учебных заведений.

Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, ООО НПЦ «ЭЛС-94» (г. Москва), Промышленной группы "Тегас" г. Краснодар.

УДК 538.9
ББК 22.34

ISBN 978-5-6041274-0-7

©Кубанский государственный
университет, 2018

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГЕРМАНИЯ В ТГЦ ОБЛАСТИ СПЕКТРА

**И.А. Каплунов¹, Г.И. Кропотов², В.Е. Рогалин^{1,3},
В.Л. Евстигнеев³, А.И. Колесников¹**

¹*Тверской государственной университет
170100, ул. Желябова, 33, Тверь, РФ; Kaplunov.ia@tversu.ru,
+74822322839*

²*ООО «Тидекс», 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная,
д. 16, grigorykropotov@tydexru*

³*АО «Национальный центр лазерных систем и комплексов
«Астрофизика»
125424, Волоколамское ш., 95, Москва, РФ; v-rogalin@mail.ru,
+79166966282*

Длинноволновую часть электромагнитного спектра (~ 3 мм - 30 мкм, 3 см^{-1} - 300 см^{-1}) принято называть - терагерцовое (ТГц) излучение [1]. В настоящее время активно ведутся работы по накачке ТГц сред мощным излучением CO_2 лазера [2]. Сейчас в ТГц диапазоне используются кристаллический кварц, Si, сапфир, ряд полимеров, что недостаточно для развития этой области. В данной работе исследовались оптические свойства чистого и легированного Ge в ТГц диапазоне.

В ИК технике Ge применяется, в основном, для диапазона 8 – 14 мкм [3, 4]. В ТГц диапазоне интересны активные элементы акустооптических устройств из Ge [5]. Ge может быть использован для применения в многоспектральных тепловизионных приборах ИК + ТГц диапазонов, а также в лазерах ТГц диапазона, накачиваемых CO_2 лазером.

Эксперименты проводились с помощью фурье-спектрометров в области 1.3 - 670 мкм Bruker Vertex 70 и Bruker IFS 66v/s. а в диапазоне 100 ± 1500 мкм - Tera K8 Menlo Systems.

Ge выращивался методом Чохральского в направлении $\langle 111 \rangle$. Исследовали Ge, выращенный из нелегированного расплава, и Ge, легированный сурьмой (Sb) и галлием (Ga), для

изучения влияния проводимости на пропускание. Образцы диаметром 39 мм полировались с допусками $N < 1$, $\Delta N < 0,5$.

Расчет коэффициента ослабления α проводился с учетом многократных отражений по известной формуле [6]

$$T = \frac{(1-R)^2 e^{\alpha h}}{e^{2\alpha h} - R^2},$$

где T и R - коэффициенты пропускания и отражения; h – толщина.

Спектральные зависимости Ge (Sb) с разным удельным электросопротивлением ρ приведены на рис. 1. На рис. 2 приведены коэффициенты ослабления наиболее характерных образцов Ge в диапазоне $\lambda = 60 - 1500$ мкм. Видно, что с ростом λ потери снижаются, достигая в максимуме, при ~ 220 мкм, в собственном Ge величины $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$. Далее, наблюдается рост поглощения с увеличением λ . В ИК области Ge n -типа проводимости имеет более высокое пропускание, что определяется малым сечением поглощения электронов по сравнению с дырками (соотношение по разным источникам составляет $\sim 16 - 100$ раз [3]). Полученные результаты показали существенный рост поглощения легированного Ge в ТГц диапазоне, по сравнению с нелегированным (рис. 1, 2, $\rho = 47 \text{ Ом}\cdot\text{см}$). Рост концентрации примеси, как электронной, так и дырочной, приводит к возрастанию поглощения. Если в области $25 - 50$ мкм влияние ρ на пропускание Ge (Sb), практически не заметно, то в области $120 - 220$ мкм оно наблюдается воочию.

Сравнение пропускания Si и Ge в диапазоне $\lambda \geq 25$ мкм, показывает большие значения для Si ($\sim 55\%$) по сравнению с Ge . Это обусловлено различием в френелевском отражении (в ИК области показатель преломления $\text{Ge} \sim 4.0$, а для $\text{Si} \sim 3.42$). Предполагается, что основное поглощение в рассматриваемом диапазоне происходит на свободных носителях заряда (собственных, и примесных). В чистом Si и Ge концентрации существенно различаются (собственный Ge : $47 \text{ Ом}\cdot\text{см}$; $E = 0.67 \text{ эВ}$; $n = 2.5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$. Собственный Si : $2 \text{ кОм}\cdot\text{см}$; $E = 1.12 \text{ эВ}$; $n = 5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$). Поэтому, поглощение в ТГц области в Ge должно быть заметно выше, чем в Si . Если сопоставить результаты по Ge (рис. 2, в области $\lambda \sim 160 - 220$ мкм) и данные по Si [7], то они

свидетельствуют, что коэффициент ослабления примерно совпадает, и равен $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$.

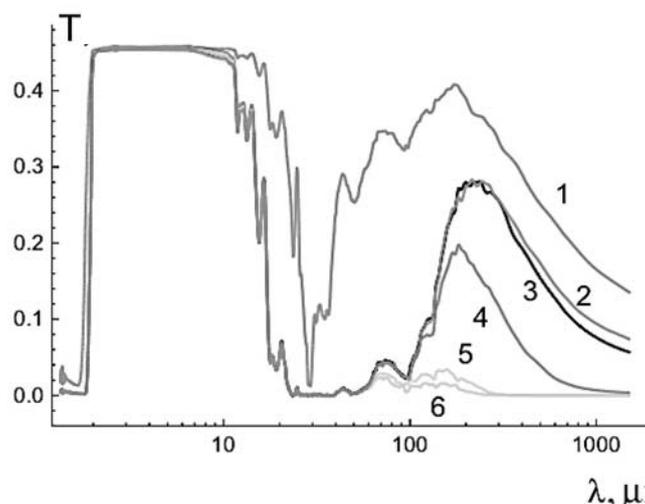


Рис. 1. Оптическое пропускание монокристаллического Ge, легированного сурьмой.

1 – нелегированный Ge (толщина 1 мм); 2 – нелегированный Ge; 3 – 46 Ом·см; 4 – 20 Ом·см; 5 – 5 Ом·см; 6 – 2.7 Ом·см (спектры 2 – 6 получены на образцах $h=10 \text{ мм}$)

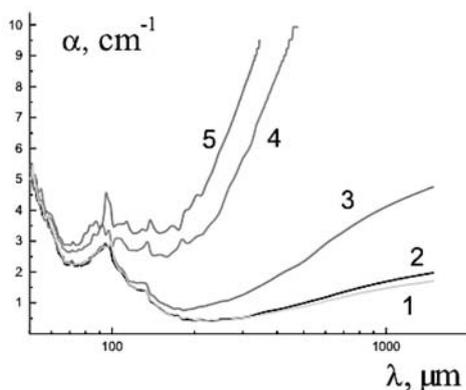


Рис. 2. Коэффициент ослабления Ge: 1 – нелегированный; легированный (Sb): 2 – 46 Ом·см; 3 – 20 Ом·см; 4 – 5 Ом·см; 5 – 2.7 Ом·см

Полученные результаты свидетельствуют, что сечение поглощения свободных носителей заряда в Si и Ge заметно различается, что может быть вызвано различием во взаимодействии носителей заряда с фононами. В отличие от ИК диапазона, в котором минимальное поглощение $\sim 0.02 \text{ см}^{-1}$ ($\lambda = 10.6 \text{ мкм}$), наблюдается в кристаллах n типа проводимости

5 – 10 Ом·см, в ТГц области минимальные потери $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$ наблюдаются в собственных кристаллах. В области 160 - 220 мкм коэффициент ослабления Ge $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$, что сопоставимо с Si. Френелевские потери на отражение могут быть, в значительной степени, скомпенсированы путём создания на поверхности периодических рельефных структур с высокой степенью регулярности и периодом меньше длины волны излучения. Следовательно, оптические изделия из собственного монокристаллического Ge могут быть использованы в ТГц диапазоне (в области $\sim 120 - 300 \text{ мкм}$).

Литература

1. Weber, Marvin J. Ph.D. "Gas Lasers" Handbook of Lasers Boca Raton: CRC Press LLC, 2001.
2. S. Ya. Tochitsky, J.E. Ralph, C. Sung, C. Joshi Generation of megawatt-power terahertz pulses by noncollinear difference-frequency mixing in GaAs // J. Appl. Phys. 2005. V. 98. P. 26101 (1-3).
3. Ровинский Р.Е., Рогалин В.Е., Шершель В.А. «Оптические свойства и области применения полупроводниковых монокристаллов германия» Изв. АН СССР (сер. Физ.). 1983. Т. 47. № 2. С. 406-409.
4. Claeys L., Simoen E. Germanium-based technologies: from materials to devices. Berlin: Elsevier. 2007. P. 449.
5. Kaplunov I.A., Nikitin P.A., Voloshinov V.B., Kolesnikov A.I., Knyazev B.A. Infrared and terahertz transmission properties of germanium single crystals // IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series. 2016. V. 37. P. 012021.
6. Курик М.В. Точность определения коэффициентов поглощения и отражения веществ // ЖПС. 1966. Т. 4. № 3. С. 275 - 278.
7. **THz Materials** [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/ru/products/thz_optics/thz_materials/

Abstract. The transmission of the intrinsic and doped with antimony and gallium germanium in the terahertz region is experimentally studied. It is shown that the intrinsic germanium in the 160 - 300 μm region has losses at the level of $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$, which is comparable with silicon.